

集成电路IC测试用数字源表

产品名称	集成电路IC测试用数字源表
公司名称	武汉普赛斯仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作环境:25 ± 10 测试范围:300mV-300V/1 精度:0.1%
公司地址	东湖开发区光谷大道308号光谷动力绿色环保产业园8栋2楼
联系电话	027-87993690 18140663476

产品详情

武汉普赛斯仪表是普赛斯电子的全资子公司，致力于半导体器件的测试仪表和测试方案的研发、生产与销售，为客户提供模块化硬件、高效驱动程序和高效算法软件组合，帮助用户构建自定义解决方案。为半导体行业提供可扩展的方案、应对设备、设计与低成本挑战。

国内率先推出的基于源表（源测单元）的两大系列产品：台式源表系列、源表单元系列，在光通信CHIP和有源光器件厂家广泛使用。

普赛斯集成电路IC测试用数字源表精度高，测试效率高，可进行超低电流和高电压测试，国产自主研发，替代进口，价格实惠

产品特点

5寸800*480触摸显示屏，全图形化操作

内置强大的功能软件，加速用户完成测试，如LIV、PIV

源及测量的准确度为0.1%，分辨率5数位

四象限工作（源和阱），源及测量范围：电流100pA~1A，电压0.3mV~300V

丰富的扫描模式，支持线性扫描、指数扫描及用户自定义扫描

支持USB存储，一键导出测试报告

支持多种通讯方式，RS-232、GPIB及以太网

S系列源表应用

I 分立半导体器件特性测试，电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC、GaN等器件；

I 能量与效率特性测试，LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等

I 传感器特性测试，电阻率、霍尔效应等

I 有机材料特性测试，电子墨水、印刷电子技术等

I 纳米材料特性测试，石墨烯、纳米线等

更多有关集成电路IC测试用数字源表信息请联系一八一四零六六三四七六